УДК 538.911

АСМ-ИССЛЕДОВАНИЕ КРИСТАЛЛОВ КИСЛОГО СУЛЬФАТА КАЛИЯ-АММОНИЯ ПРИ ПОНИЖЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ

© 2019 г. Р. В. Гайнутдинов¹, А. Л. Толстихина^{1, *}, Е. В. Селезнева¹, И. П. Макарова¹

¹Федеральное государственное учреждение "Федеральный научно-исследовательский центр "Кристаллография и фотоника" Российской академии наук", Москва, Россия

> **E-mail: alla@ns.crys.ras.ru* Поступила в редакцию 29.04.2019 г. После доработки 10.06.2019 г. Принята к публикации 27.07.2019 г.

Методом атомно-силовой микроскопии изучена поверхность естественного скола водорастворимых монокристаллов ($K_{0.43}(NH_4)_{0.57}$)₃H(SO₄)₂. Показано, что образующиеся на поверхности кристаллов сверхтонкие детали нанорельефа – ямки и выступы с устойчивыми параметрами по высоте (глубине) ~0.7 нм, – соответствуют величине 1/3 *с* в элементарной ячейке. Методом микроскопии пьезоэлектрического отклика зарегистрирован фазовый переход (из парафазы в сегнетофазу) в кристалле ($K_{0.43}(NH_4)_{0.57}$)₃H(SO₄)₂ при понижении температуры от 296 до 282 К.

DOI: 10.1134/S0367676519110103

ВВЕДЕНИЕ

Растущие темпы энергопотребления стимулируют интерес во всем мире к исследованиям и разработкам материалов для энергоэффективных технологий. Топливные элементы, основным компонентом которых является протонообменная мембрана, обеспечивают прямое преобразование химической энергии в электрическую. При этом их КПД по сравнению с двигателями внутреннего сгорания намного выше, и они экологически безопасны. Ключевым параметром для материала мембраны является проводимость. Немаловажными факторами также являются сочетание высокой проводимости с низкой температурой эксплуатации, низкой газопроницаемостью, низким коэффициентом диэлектрических потерь, а также простотой получения материала и низкой стоимостью. Таким требованиям удовлетворяют кристаллы-суперпротоники с общей формулой $M_m H_n (AO_4)_{(m + n)/2} \cdot y H_2 O$ (M = K, Rb, Cs, NH₄, $AO_4 = SO_4$, SeO₄, HPO₄, HAsO₄), проводимость которых достигает 10⁻³-10⁻¹ Ом⁻¹ · см⁻¹ в диапазоне рабочих температур 343-503 К [1]. Следует отметить, что проводимость этих материалов связана с их структурными особенностями, а не с допирующими добавками, что обусловливает их уникальность в классе протонных проводников.

В Институте кристаллографии впервые были получены кристаллы $(K_x(NH_4)_{1-x})_m H_n(SO_4)_{(m+n)/2} \cdot yH_2O$ в солевой системе $K_3H(SO_4)_2-(NH_4)_3H(SO_4)_2-H_2O$ [2], для исходных соединений $K_3H(SO_4)_2$ и

(NH₄)₃H(SO₄)₂, для которой ранее было установлено наличие суперпротонных фазовых переходов с принципиально различной кинетикой [3]. В результате проведенных исследований была установлена структурная обусловленность аномалий физических свойств этих соединений [2-4]. В отличие от известных кристаллов M_3 H(AO_4)₂, претерпевающих при нагревании суперпротонный фазовый переход с повышением симметрии от моноклинной до тригональной (переход из сегнетофазы в парафазу), кристаллы $(K, NH_4)_3 H(SO_4)_2$, в состав которых вошло 57% аммония, кристаллизуются в фазе, уже при комнатной температуре, имеющей суперпротонную проводимость. Симметрия кристаллов $(K_{0,43}(NH_4)_{0,57})_3H(SO_4)_2$ при *T* ≈ 293 К тригональная, пространственная группа $R\overline{3}, Z=3, a=b=5.7768(3), c=22.0983(1)$ Å [5]. Тригональная симметрия фазы обусловлена соотношением заселенности позиций К/N и соответствующей координацией групп NH₄, что приводит к разупорядочению позиций атомов кислорода, участвующих в водородных связях, образованию динамически разупорядоченной системы водородных связей и, как следствие, появлению высокой проводимости. Несомненный интерес представляют данные об изменении структуры и физических свойств кристаллов $(K_{0,43}(NH_4)_{0.57})_3H(SO_4)_2$ как при повышении температуры, так и при температурах ниже 293 К. Судя по изменению энергии активации проводимости в районе 283 К, и по аналогии с изоструктурными соединениями, можно ожидать наличие фазовых переходов (парафаза—сегнетофаза) при T < 293 К у этого кристалла [5].

Целью работы было изучение реальной структуры и фазовых переходов в кристаллах $(K_{0.43}(NH_4)_{0.57})_3H(SO_4)_2$ в диапазоне температур от 278 до 296 К методами атомно-силовой микроскопии (ACM). Для этого был использован один из наиболее эффективных методов ACM — микроскопия пьезоэлектрического отклика (МПО), в основе которой лежит регистрация локального пьезоотклика материала при приложении переменного электрического поля к проводящему зонду.

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ И ОБРАЗЦЫ

Кристаллы ($K_{0.43}(NH_4)_{0.57}$)₃H(SO₄)₂ были выращены в Институте кристаллографии методом управляемого снижения растворимости из водных растворов K₃H(SO₄)₂ и (NH₄)₃H(SO₄)₂ при соотношении K : NH₄ ~ 3 : 7. Кристаллизация проводилась в диапазоне температур 303–313 К. Выращенные кристаллы имели пластинчатый габитус. Структуру и формульный состав кристаллов уточняли с помощью рентгеноструктурного анализа на дифрактометре Xcalibur S фирмы Oxford Diffraction с двумерным CCD-детектором при температуре 295 К. Обработку экспериментальных данных, кристаллографические расчеты, включая моделирование структуры, проводили с помощью программ CrysAlisPRO [6] и JANA 2006 [7].

Исследование образцов было проведено на атомно-силовом микроскопе NTEGRA Prima (NT-MDT Spectrum Instruments, Зеленоград) в условиях чистой зоны в контрольно-измерительном комплексе "TRACKPORE ROOM-05" (класс чистоты 5 ИСО(100), точность поддержания температуры воздушной среды в чистой зоне в диапазоне от 293 до 303 К составила ± 0.05 К, относительная влажность воздуха — $35 \pm 1\%$). Пьезоэлектрический отклик регистрировали в контактном режиме при приложении переменного электрического поля V_{ac} с амплитудой 4 В и частотой 140 кГц к кремниевому кантилеверу (HA_NC/Pt, балка B, Tipsnano, Эстония), покрытому Pt, со следующими характеристиками: резонансная частота $f = 140 \text{ к}\Gamma\mu$, жесткость k = 3.5 H · м⁻¹, радиус закругления острия R < 30 нм. Исследование микрорельефа поверхности проводили в прерывисто-контактном режиме с использованием кантилеверов той же марки.

Температурные измерения локальных физических свойств кристаллов проводили на атомно-силовом микроскопе NTEGRA Prima (NT-MDT Spectrum Instruments, Зеленоград) со сканирующей измерительной головкой SMENASFC102LNTF с контроллером PB2,0 для реализации прыжковой моды и ячейкой с контролем температуры MP6LC в диапазоне поддержания температуры от 243 до 393 К на воздухе. Использовали кантилеверы марки NSG01/Pt того же производителя ($f = 150 \text{ к}\Gamma\mu$, $k = 5.1 \text{ H} \cdot \text{m}^{-1}$, R = 25 нм). Переменное напряжение V_{ac} на острие зонда подавалось с амплитудой 8 В и частотой 160 к $\Gamma\mu$. Максимальная сила взаимодействия зондового датчика с поверхностью в процессе высокоскоростной силовой спектроскопии составляла 160 нН. Температура менялась трижды: с 296 ± 0.1 до 278 ± 0.1 К и обратно.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Поверхность (001) кристаллов, полученная свежим сколом в воздушной среде, была изучена в прерывисто-контактном режиме АСМ. На рис. 1а показан характерный ступенчатый рельеф участка поверхности размером 30 × 30 мкм². Согласно профилю сечения на рис. 16 минимальная высота ступеней, образующихся при расколе, составляет ~0.7 нм. Среднеквадратичная шероховатость поверхности $R_q = 2$ нм. На рис. 1*в* приведено ACMизображение участка поверхности с большим увеличением (5 \times 5 мкм²) одной из ступеней. На атомно-гладкой поверхности естественного скола обнаруживается образование большого количества ямок глубиной около 0.7 нм и отдельных выступов высотой 0.7-0.8 нм с латеральными размерами 20-150 и 50-150 нм, соответственно. Глубина/высота элементов нанорельефа поверхности исследуемого кристалла кратна доли параметра элементарной ячейки и составляет примерно 1/3 с. Образование ступенчатого нанорельефа в виде ямок и выступов с высотой/глубиной, кратной долям параметра элементарной ячейки, не является чем-то необычным и наблюдается при расколе других водорастворимых кристаллов со спайностью, например, триглицин сульфата [8], бифталатов цезия и аммония [9]. Изучение изображений фазового контраста показывает, что поверхность кристалла (K_{0.43}(NH₄)_{0.57})₃H(SO₄)₂, полученная свежим сколом, однородна с точки зрения фазового состава.

Если обратиться к модели атомной структуры кристалла ($K_{0.43}(NH_4)_{0.57}$) $_3H(SO_4)_2$, то можно видеть, что вдоль оси *с* в элементарной ячейке располагаются три слоя тетраэдров SO₄, соединенных водородными связями, среди которых и между которыми находятся позиции K/NH₄ (рис. 2). То есть наблюдаемый поверхностный нанорельеф в виде ямок/выступов с глубиной/высотой, кратной 1/3 параметра элементарной ячейки, коррелирует с особенностями слоистой структуры кристалла ($K_{0.43}(NH_4)_{0.57}$) $_3H(SO_4)_2$.

Наблюдение за кристаллами показало, что поверхность гигроскопична и со временем деградирует. Рисунок 3 иллюстрирует произошедшие с



Рис. 1. АСМ-изображения микрорельефа поверхности (001) естественного скола кристалла ($K_{0,43}$ (NH₄)_{0,57})₃H(SO₄)₂ (*a*, *в*) и соответствующие профили сечения (*б*, *г*). Положение профиля сечения обозначено на изображении стрелками.

поверхностью изменения при выдержке в атмосферных условиях в течение 24 ч. Рельеф заметно огрубляется, что можно видеть из профиля сечения поверхности (рис. 46). Шероховатость увеличивается примерно в 5 раз ($R_q = 10.4$ нм) по сравнению с исходной.

При исследовании кристаллов при комнатной температуре методом МПО не был обнаружен пьезоэлектрический отклик как для образцов, полученных свежим сколом, так и после полировки поверхности. Рис. 4 демонстрирует структурные изменения в кристалле, которые происходили при понижении температуры от 296 до 278 К. На рис. 4*a*, 4*б* приведено топографическое изображение участка полированной поверхности (001) кристалла и МПО-изображение, которое показывает, что в исходном состоянии при T = 296 K образец находился в парафазе. При понижении температуры до 282 К наблюдался переход в сегнетоэлектрическое состояние (рис. 4в). На монодоменных участках видны небольшие домены размером около 1 мкм противоположного знака. Измерение механических свойств в гибридной моде позволяет наблюдать небольшие участки с твердостью ниже, чем у основной матрицы (рис. 4г). При понижении температуры до 278 К каких-либо изменений структуры не происходило (рис. 4*д*). При нагреве до 296 К кристалл из сегнетофазы опять переходил в парафазу. Повторное изменение температуры в интервале 278—296 К показало, что фазовый переход (сегнетофаза-парафаза) обратимый.



Рис. 2. Атомная структура кристаллов $(K_{0,43}(NH_4)_{0.57})_3H(SO_4)_2$. Показаны тетраэдры SO₄, соединенные водородными связями, и расположение атомов K и групп NH₄.



Рис. 3. АСМ-изображение микрорельефа поверхности (001) естественного скола кристалла ($K_{0.43}(NH_4)_{0.57}$)₃H(SO₄)₂ после выдержки на воздухе при 296 К в течение 24 ч (*a*) и соответствующий профиль сечения (δ). Положение профиля сечения обозначено на изображении стрелками.



Рис. 4. АСМ-изображения кристалла ($K_{0.43}(NH_4)_{0.57}$)₃H(SO₄)₂ в зависимости от температуры: *a* – микрорельеф полированной поверхности (контактный режим), *b*, *b*, *b*, *d* – фаза латерального пьезоотклика (контактная МПО), *e* – жест-кость (отн. ед.) (гибридная мода).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методом микроскопии пьезоэлектрического отклика впервые зарегистрирован фазовый переход (из парафазы в сегнетофазу) в кристалле $(K_{0.43}(NH_4)_{0.57})_3H(SO_4)_2$ при понижении температуры от 296 до 282 К. Полученная информация находится в согласии с данными диэлектрической спектроскопии [5] и дополняет данные рентгеноструктурного анализа. Природа наблюдаемого фазового перехода в новых суперпротонных кристаллах требует дополнительного исследования.

Авторы выражают благодарность В.В. Долбининой (ИК РАН) за образцы кристаллов, А.С. Калинину (NT-MDT Spectrum Instruments) за помощь в работе. Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования в рамках выполнения работ по Государственному заданию ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН и частично при поддержке Программы фундаментальных исследований Президиума РАН 1.2.П № 32. Эксперименты проводились с использованием оборудования ЦКП ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. *Баранов А.И.* // Кристаллография. 2003. Т. 48. № 6. С. 1081; *Baranov A.I.* // Crystallogr. Rep. 2003. V. 48. № 6. Р. 1012.
- Дмитричева Е.В., Макарова И.П., Гребенев В.В. и др. // Кристаллография. 2014. Т. 59. № 3. С. 387; Dmitricheva E.V., Makarova I.P., Grebenev V.V. et al. // Crystallogr. Rep. 2014. V. 59. № 3. Р. 344.

- 3. Макарова И.П., Черная Т.С., Филаретов А.А. и др. // Кристаллография. 2010. Т. 55. № 3. С. 429; Makarova I.P., Chernaya T.S., Filaretov A.A. et al. // Crystallogr. Rep. 2010. V. 55. № 3. Р. 393.
- Дмитричева Е.В., Макарова И.П., Гребенев В.В. и др. // Кристаллография. 2014. Т. 59. № 6. С. 966; Dmitricheva E.V., Makarova I.P., Grebenev V.V. et al. // Crystallogr. Rep. 2014. V. 59. № 6. Р. 878.
- Selezneva E.V., Makarova I.P., Malyshkina I.A. et al. // Acta Cryst. B. 2017. V. 73. P. 1105.
- 6. https://www.rigaku.com/en/products/smc/crysalis
- 7. *Petřiček V., Dušek M., Palatinus L.* Jana 2006. Structure determination software programs. Praha: Institute of Physics, 2006.
- 8. Belugina N.V., Tolstikhina A.L., Gainutdinov R.V. // Ferroelectrics. 2001. V. 249. P. 237.
- 9. Толстихина А.Л., Белугина Н.В., Гайнутдинов Р.В. // Поверхность. Рентген, синхротрон. и нейтрон. исслед. 2003. № 3. С. 51.